

# สแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้ (Scanning Probe Microscopy for Near-field Optics Research)

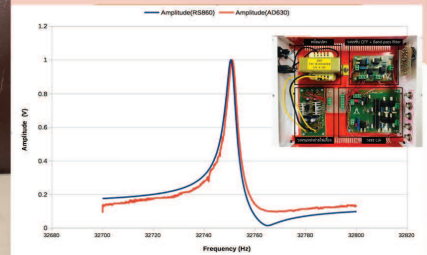
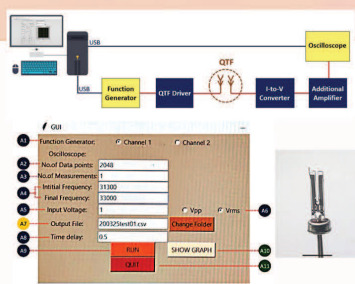
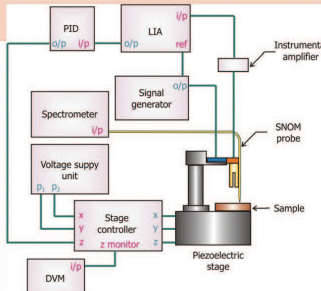
- หัวหน้าโครงการ: ดร. ทิพย์สุดา ไชยไพฑูริย์วงศ์
- ที่ปรึกษาโครงการ: รศ. มนุ เพ็ญพิง
- นักศึกษาปริญญาโท: จุฑาภรณ์ วรรณภูมิ

สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เป้าหมายโครงการ	งบประมาณ/ช่วงเวลาดำเนินการ	ประสิทธิผล
<ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนาเครื่องสแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปี ที่ใช้ระบบป้อนกลับด้วยแรงเฉื่อยเพื่อถ่ายภาพพื้นผิววัสดุเพื่อเป็นงานต้นแบบสำหรับพัฒนาเป็นเครื่องสแกนนิ่งเนียร์ฟิลด์ไมโครสโกปี (SNOM) พัฒนางานต้นแบบเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,000,000 บาท</li> <li>• ปีงบประมาณ 2560 – ปีงบประมาณ 2562</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิ่งประดิษฐ์</li> <li>• โปรแกรมควบคุมการวัดการสั่นของโพรบแบบอัตโนมัติ</li> <li>• เครื่องล็อกอินแอมพลิไฟเออร์ต้นทุนต่ำ</li> <li>• ผลผลิต</li> <li>• นักศึกษาปริญญาโท 1 คน</li> <li>• นำเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง</li> <li>• บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 1 บทความ</li> <li>• บทความวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์ (ระหว่างการจัดเตรียม)</li> </ul>
ผลกระทบ	ความสอดคล้อง	ความยั่งยืน
<ul style="list-style-type: none"> <li>• งานศึกษาด้านแบบเพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดในการสร้างเครื่องมือทางด้านไมโครสโกปีที่อยู่บนพื้นฐานการตรวจจับสนงเนียร์ฟิลด์ (near-field) ที่ความละเอียดภาพไม่ถูกจำกัดด้วยการเลี้ยวเบน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนาร่างงานอุปกรณ์เครื่องมือต้นทุนต่ำที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องสแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปีขึ้นใช้งานได้เองภายในประเทศ เทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• องค์ความรู้เชิงเทคนิคในการพัฒนาสร้างอุปกรณ์เครื่องมือสแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปี เพื่อการส่งเสริมงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีที่มีความต้องการระบบไมโครสโกปีที่มีความละเอียดระดับต่ำกว่าความยาวคลื่น</li> </ul>

## ผลการดำเนินโครงการ



### ระบบสแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปี

- หัวใจหลักของระบบสแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปี (SPM) คือการควบคุมให้หัววัดหรือโพรบ (probe) เข้าใกล้พื้นผิวของวัสดุในระดับไมโครเมตร เพื่อตรวจจับสนงที่ไม่เคลื่อนที่ (non-propagating field) ที่มีความถี่เชิงปริภูมิสูง (high spatial frequency) ซึ่งสัมพันธ์กับความละเอียดสูงของภาพที่ไม่ถูกจำกัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสงซึ่งจำกัดระดับความละเอียดของไมโครสโกปีแบบดั้งเดิม

### โพรบส้อมเสียงควอตซ์และระบบวัดการตอบสนองเชิงความถี่

- โพรบส้อมเสียงควอตซ์ที่ติดตั้งบนปลายแหลมที่ใช้ทำชิ้นในงานวิจัยนี้เพื่อเป็นโพรบสำหรับระบบ SPM ที่มีความถี่ฐานของการสั่น 32.768 กิโลเฮิรตซ์
- ประสิทธิภาพการควบคุมความสูงของหัวโพรบจากพื้นผิวอาศัยการตรวจจับสนงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการสั่นของหัวโพรบอันเนื่องมาจากแรงเฉื่อย (shear force) โดยสะท้อนผ่านค่าแฟกเตอร์คิว (Q-factor)
- ระบบวัดการตอบสนองเชิงความถี่ (frequency response) ของหัวโพรบในงานวิจัยนี้ควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมภาษาไพธอนที่พัฒนาขึ้น

### ฐานรองตัวอย่าง

- ฐานรองตัวอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ SPM ที่ออกแบบขึ้นในโครงการวิจัยนี้สามารถเลื่อนตัวอย่างขึ้น – ลงในแนวตั้งซึ่งมีความละเอียดถึง 1 ไมโครเมตร มีความกว้างและความสูง เท่ากับ 14.5 และ 23.6 เซนติเมตร
- ฐานที่ใช้สำหรับวางตัวอย่างมีขนาด 5 ตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ยังมี หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล ซึ่งแสดงระดับการเลื่อนของตัวอย่าง

### ล็อกอินแอมพลิไฟเออร์

- ล็อกอินแอมพลิไฟเออร์ (Lock-in Amplifier, LIA) คืออุปกรณ์สำคัญในระบบควบคุมความสูงของโพรบ โดยล็อกอินแอมพลิไฟเออร์สามารถแยกขนาดและเฟสของสัญญาณรบกวนที่มีความถี่ตรงกับความถี่ที่กระตุ้นระบบโพรบส้อมเสียง
- โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องล็อกอินแอมพลิไฟเออร์แบบพหุหน้าที่ โดยเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับผลกวัดกับเครื่องล็อกอินแอมพลิไฟเออร์เชิงพาณิชย์ SR860 ของบริษัท Stanford Research Systems ซึ่งผลการวัดสัญญาณจากโพรบส้อมเสียงจากเครื่องล็อกอินแอมพลิไฟเออร์ที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถวัดผลได้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับเครื่องเชิงพาณิชย์

